(CdZnTe, ZnSeTe)ZnTe复合量子阱中激子隧穿过程*

金 4^{1} ⁺ 刘 舒¹) 张振中²) 张立功²) 郑著宏²) 申德振²)

1)(中国人民公安大学安全防范系,北京 102416)
 2)(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所激发态物理重点实验室,长春 130033)
 (2008 年 1 月 5 日收到 2008 年 2 月 2 日收到修改稿)

设计了(CdZnTe ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱结构,并用吸收光谱、室温光致发光谱和飞秒脉冲抽运-探测方法研究了该复合结构中的激子隧穿过程.分别测量了该结构中 CdZnTe/ZnTe 量子阱层和 ZnSeTe/ZnTe 量子阱层中激子衰减时间.观察到从 CdZnTe/ZnTe 量子阱层向 ZnSeTe/ZnTe 量子阱层的快速激子隧穿,隧穿时间为 5.5 ps.

关键词:(CdZnTe,ZnSeTe)/ZnTe复合量子阱,激子,隧穿,抽运-探测 PACC:7865K,7135,7340G,7847

1.引 言

量子隧穿过程在半导体物理基础理论和光电子 器件应用方面有重要的研究价值1-51.宽带 [[-1]族 半导体材料具有大的激子束缚能 激子效应显著增 强 成为研究激子隧穿过程的理想材料体系 近年 来 半导体异质结构中隧穿过程的研究主要围绕非 对称双量子阱体系展开^[6,7].在非对称双量子阱的研 究中,人们利用非对称特性使相邻阱中的电子(空 穴 能级彼此错开 隧穿效应使激子在短时间内由窄 阱单向的隧穿到相邻宽阱中^[8-11],缩短窄阱中激子 寿命,为快速光开关器件的设计提供了基础,但是非 对称量子阱系统有一个不可避免的缺陷:在外来光 子激发窄阱的同时 宽阱中的载流子也会受到激发, 导致宽阱的相关能态先被占据,这不仅削弱了隧穿 的作用 降低窄阱的激子衰减速度 而且会影响到窄 阱的光学非线性的大小,为此,我们引入了 ZnSeTe/ ZnTe || 型量子阱,用 ZnSeTe/ZnTe || 型量子阱代替 双阱结构中的宽阱,设计了(CdZnTe,ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱结构.其中 ZnSeTe/ZnTe 阱为 II 型异质 结 ZnSeTe 阱 n = 1 的电子能级低于 CdZnTe 阱 n = 1的电子能级,但其n=1的激子吸收能量要高于 CdZnTe,因此既可以接受 CdZnTe/ZnTe 量子阱中隧 穿过来的激子,又不影响 CdZnTe 量子阱光学非线性

的大小,从而加快 CdZnTe/ZnTe 阱中激子的衰减,提高(CdZnTe ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱光开关的关断速度.

在本文中,我们采用吸收光谱、室温光致发光谱 和飞秒脉冲抽运-探测技术研究了(CdZnTe,ZnSeTe)/ ZnTe 复合量子阱结构中的激子隧穿过程,观察到从 CdZnTe/ZnTe 量子阱向 ZnSeTe/ZnTe 量子阱的快速激 子隧穿过程,并对实验结果进行了拟合.

2.实 验

(CdZnTe, ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱是用 MOCVD方法生长在GaAs(100)衬底上,其结构为, GaAs衬底-55 nm ZnSe 过渡层[32 nm ZnTe分隔层-6nm SeZnTe 阱-8 nm ZnTe 垒-3 nm CdSeTe 阱]×10个 周期-90 nm ZnTe 盖层.将样品贴在石英玻璃上,用 研磨与湿法化学腐蚀的方法去掉GaAs衬底,制备可 供飞秒抽运-探测研究的器件结构.样品的能级结构 示意图如图1所示.其中箭头 a 代表 CdZnTe 阱中激 子的复合发光,b,c,d和 e四个箭头分别代表 CdZnTe 阱中电子向ZnSeTe 阱中隧穿和ZnSeTe 阱中 电子几种可能的跃迁途径.该结构可通过b-c,b-d和b-e过程来加快CdZnTe 阱中激子的衰减,从而提 高光开关的关断速度.

^{*}国家自然科学基金(批准号 160278031 160176003 和 60376009)资助的课题.

[†] E-mail: jinhua@m165.com



图 1 (CdZnTe ,ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱的能级结构示意图

3.结果与讨论

图 2 为样品的吸收光谱,利用二级导数吸收光 谱判断出吸收峰位置在 2.18 和 2.25 eV 处,分别为 ZnSeTe 量子阱和 CdZnTe 量子阱的吸收.可以看到量 子阱的吸收边是缓变的,这反映出异质结应变引起 平带畸变的存在.而较宽的吸收包络则反映出吸收 过程中有声子参与.



图 2 (CdZnTe ,ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱的室温吸收谱(a)和二 级导数吸收谱(b)

图 3 给出了样品的室温发光光谱,激发源为氩 离子激光器的 488 nm 激光线.从发光谱中可以看 到 发光谱是由两个峰值在 2.17 和 2.24 eV 的发光 峰叠加而成,分别对应 ZnSeTe 量子阱和 CdZnTe 量 子阱的发光.其中 ZnSeTe 的发光比较强,说明大量 激子被收集到 ZnSeTe 阱层中并辐射复合(对应这图 1 中的 d 或 e 过程 ,而 c 过程的复合要穿越实际空间 ,概率很小).



图 3 (CdZnTe ,ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱的室温发光光谱

为了研究激子在(CdZnTe,ZnSeTe)/ZnTe复合量 子阱中的行为,我们在室温下对样品进行了飞秒脉 冲白光抽运-探测的测量,分别探测了CdZnTe量子 阱和ZnSeTe量子阱中的激子衰减时间.实验采用 Spectra-Physics公司生产的钛宝石锁模飞秒激光器, 经再生放大器后输出激光脉冲宽度为130 fs,重复 频率为1kHz,波长为800 nm,单脉冲能量为2 mJ的 超短脉冲.脉冲激光束经分束镜后分成探测光与抽 运光,两束光的强度比为1:15.探测光经可变光学 延迟线后聚焦在水盒上,产生白光,抽运光经过 0.5 mm厚的BBO倍频晶体倍频后再与探测光非共线 的聚焦到样品上.透过样品的探测光经单色仪分光, 由光电倍增管接收.对抽运光进行斩波作为参考信 号,由光电倍增管接收的信号通过锁相放大器后可以 直接提取抽运光对探测光透射的强度变化的影响.

在低激发强度下,探测光透射强度变化 △T 与 样品吸收系数一级近似项成线性关系.吸收系数的 变化反应了粒子数分布密度的变化,可以获得激子 动力学过程的信息.改变延迟时间,探测光相对透射 强度的变化可以表示为

$$\Delta T = \Delta T_0 \cdot e^{-t/\tau + \Gamma} , \qquad (1)$$

其中 ΔT_0 为 t = 0 时刻相对透射强度 , τ 为量子阱 中的激子衰减时间 , Γ 为抽运光与探测光脉冲宽度 之和(260 fs).

图 4 为(CdZnTe,ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱的差 分透射信号随时间变化的瞬态透射衰减曲线,探测 能量在 2.25 eV 处,对应 CdZnTe 量子阱中激子吸收 能级位置.可以看出 CdZnTe 量子阱中激子的衰减为 双指数过程.拟合得到,衰减曲线包含一个占优且快的5.5 ps的衰减和一个慢的110.9 ps的衰减过程, 考虑到拟合误差的影响,没有扣除抽运光与探测光 脉冲宽度之和.这一结果表明 CdZnTe 阱层中的大部 分激子在几个皮秒内迅速离开该能级位置,少量的 激子会在100 ps 左右也离开该能级.慢的衰减时间 与 CdZnTe/ZnTe 多量子阱中的激子寿命相当,来自 CdZnTe 阱层的复合(对应图1中的 *a* 过程)¹²¹.而快 至几个皮秒的衰减表明在该复合结构中存在着从 CdZnTe 阱向 ZnSeTe 阱的高效率激子隧穿(对应图1 中的 *b* 过程).由于在 CdZnTe/ZnTe 量子阱旁引入了 ZnSeTe/ZnTe []型量子阱使得 CdZnTe 阱中激子的衰 减时间大大缩短,大量激子通过隧穿离开 CdZnTe 量 子阱,并注入到 ZnSeTe 量子阱中,而后辐射复合,这 与前面对发光光谱的讨论相一致.



图 4 (CdZnTe ,ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱的瞬态透射衰减曲线 (对应探测能量在 2.25 eV)

图 5 为(CdZnTe, ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱的差 分透射信号随时间变化的瞬态透射衰减曲线,探测

- Muto S, Inata T, Tackeuchi A, Sugiyama, Fujii T 1991 Appl. Phys. Lett. 58 2393
- [2] Krol M F , Leavitt R P , Pham J T , Mc Ginnis B P , Peyghambarian N 1995 Appl. Phys. Lett. 66 3045
- [3] Lury S 1988 Solid State Commun. 65 787
- [4] Yang J, Wu W Y, Gong Y C 2008 Acta Phys. Sin. 57 448 (in Chinese)[杨 军、武文远、龚艳春 2008 物理学报 57 448]
- [5] Wu Z J, Zhu K D, Yuan X Z, Zheng H 2005 Acta Phys. Sin.
 54 3346 (in Chinese)[吴卓杰、朱卡的、袁晓忠、郑 杭 2005 物理学报 54 3346]
- [6] Hu Z H, Huang D X 2005 A [1788 (in Chinese)] [胡振华、黄德修 2005 物理 784 1788]

能量在 2.18 eV 处,对应 ZnSeTe 量子阱中激子吸收 能级位置.从图 5 中看出 ZnSeTe 中的激子衰减为单 指数衰减过程,拟合得到衰减时间在 100 ps 左右,这 与 ZnSeTe 中载流子的复合相关.



图 5 (CdZnTe ZnSeTe)ZnTe 复合量子阱的瞬态透射衰减曲线 (对应探测能量在 2.18 eV)

4.结 论

本文设计了(CdZnTe,ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱 结构,将ZnSeTe/ZnTe II 型量子阱引入复合结构中 代替对称双量子阱结构中的宽阱,以加快CdZnTe/ ZnTe 阱中激子的衰减,提高光开关的关断速度.通 过吸收光谱、室温发光谱和抽运-探测方法观察到在 (CdZnTe,ZnSeTe)/ZnTe 复合量子阱中存在激子快速 隧穿过程,由CdZnTe 层向ZnSeTe 层的激子隧穿时 间为5.5 ps.表明该复合结构可以有效的减小 CdZnTe 层中的激子寿命,提高载流子的隧穿时间, 对新型超快隧穿器件的研制提供了新思路.

- [7] Hieke K, Heimbrodt W, Pier T, Gumlich H E, Rühle W W, Nicholls J E, Lunn B 1996 J. Crys. Grow. 159 1014
- [8] Ten S , Krol M F , McGinnis B P , Hayduk M J 1996 J. Appl . Phys. 79 1526
- [9] Krol M F, Ten S, McGinnis B P, Hayduk M J, Khitrova G, Peyghambarian N 1995 Phys. Rev. B 52 14344
- [10] Weil T, Vinter B 1986 J. Appl. Phys. 60 3227
- [11] Ten S , Henneberger F , Rabe M , Peyghambarian N 1996 Phys. Rev. B 53 12637
- [12] Stanley R P, Hegarty J, Fischer R, Feldmann J, Göbel E O, Feldman R D, Austin R F 1991 Phys. Rev. Lett. 67 128

Exciton tunnelling in (CdZnTe ,ZnSeTe)/ZnTe complex quantum wells *

Jin Hua¹)[†] Liu Shu¹) Zhang Zhen-Zhong²) Zhang Li-Gong²) Zheng Zhu-Hong²) Shen De-Zhen²)

1) Security and Prevention Department , Chinese People's Public Security University , Beijing 102416 , China)

2 X Key Laboratory of Excited State Processes , Changchun Institute of Optics , Fine Mechanics and Physics ,

Chinese Academy of Sciences , Changchun 130033 , China)

(Received 5 January 2008 ; revised manuscript received 2 February 2008)

Abstract

A new type of (CdZnTe ZnSeTe)/ZnTe complex quantum wells was designed. Exciton tunneling process was investigated in this complex structure using absorption spectra , photoluminescence (PL) spectra and pump-probe measurements. The exciton decay time was measured in CdZnTe/ZnTe quantum well layers and ZnSeTe/ZnTe quantum well layers , respectively. And a fast exciton tunneling from CdZnTe/ZnTe quantum well to ZnSeTe/ZnTe quantum well was observed by transient differential transmission. The tunneling time is 5.5 ps.

Keywords :(CdZnTe ,ZnSeTe)/ZnTe complex quantum wells , exciton , tunneling , pump-probe PACC : 7865K , 7135 , 7340G , 7847

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 60278031, 60176003 and 60376009).

[†] E-mail: jinhua@m165.com